

# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2000-200418

(43)Date of publication of application : 18.07.2000

(51)Int.Cl.

G11B 7/0045

(21)Application number : 11-313657

(71)Applicant : MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD

(22)Date of filing : 04.11.1999

(72)Inventor : FURUMIYA SHIGERU  
MINAMINO JUNICHI  
SHOJI MAMORU

(30)Priority

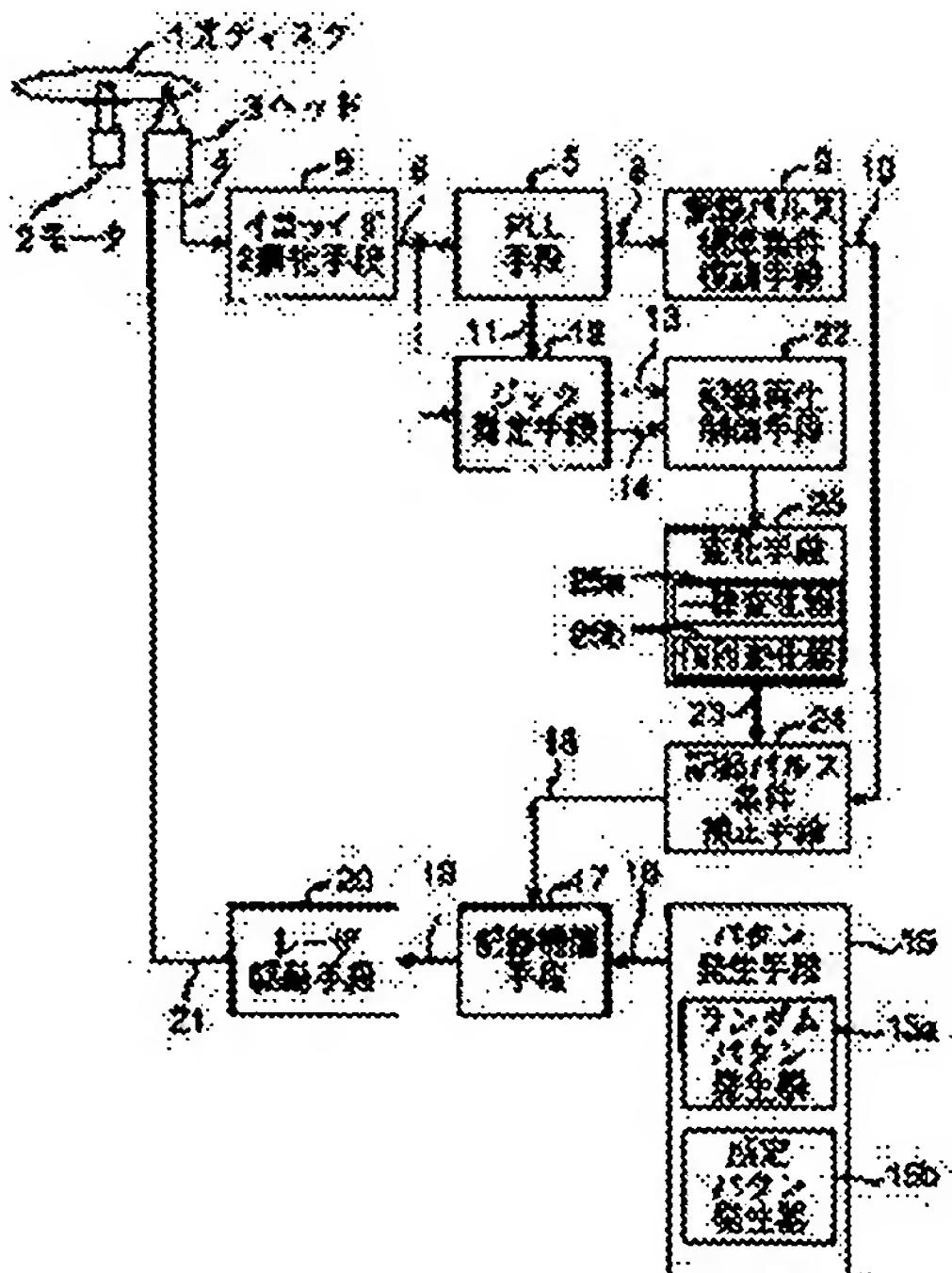
Priority number : 10315885 Priority date : 06.11.1998 Priority country : JP

## (54) METHOD FOR OBTAINING RECORDING PULSE CONDITION OF OPTICAL DISK AND ITS DEVICE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To reduce an influence of a writable optical disk and variance of a recording and reproducing characteristic by executing a first trial writing on the optical disk, detecting a first jitter from a reproducing signal, adding a first prescribed quantity of variations to positional information to a combination between a mark length and a space length and executing a second trial writing by the use of uniformly varied positional information.

SOLUTION: A recording pulse standard condition preliminarily recorded on an optical disk 1 is read and data are trial written. Next, random data are reproduced by using a multi-pulse data 19 and a jitter of a reproducing signal is measured. A recording pulse standard condition 10 sent from a recording pulse standard condition demodulating means 9



is uniformly varied with a uniform varying device 25a included in a variation means 25 and is trial written on the optical disk. A jitter voltage obtained by being repeated while varying a correction value 23 is collected, and a combination in which the large jitter voltage in the head end and the tail end among the jitter voltages becomes the minimum value or an allowable value or less is used as the optimal recording condition.

---

## LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP)

## (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開2000-200418

(P2000-200418A)

(43)公開日 平成12年7月18日 (2000.7.18)

(51)Int.Cl' G 11 B 7/0045

識別記号

F I  
G 11 B 7/0045マーク (参考)  
B

審査請求 未請求 請求項の数10 OL (全 15 頁)

(21)出願番号 特願平11-313657  
 (22)出願日 平成11年11月4日 (1999.11.4)  
 (31)優先権主張番号 特願平10-315885  
 (32)優先日 平成10年11月6日 (1998.11.6)  
 (33)優先権主張国 日本 (JP)

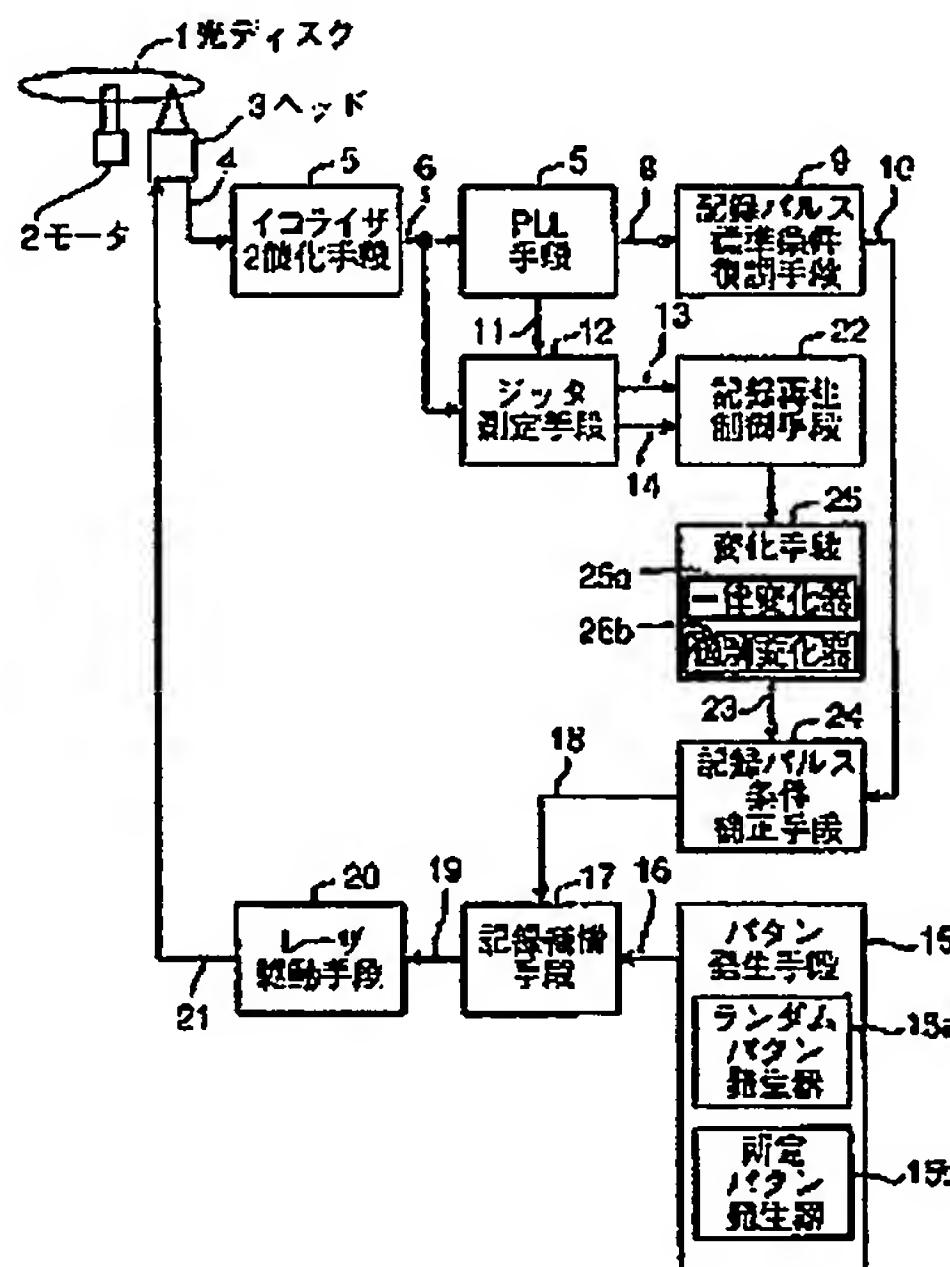
(71)出願人 00000582  
 松下電器産業株式会社  
 大阪府門真市大字門真1006番地  
 (72)発明者 古宮 成  
 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器  
 産業株式会社内  
 (72)発明者 南野 順一  
 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器  
 産業株式会社内  
 (72)発明者 東海林 駿  
 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器  
 産業株式会社内  
 (74)代理人 100062144  
 弁理士 青山 葵 (外1名)

(54)【発明の名称】光ディスクの記録パルス条件を求める方法および装置

## (57)【要約】

【課題】特性のばらついたディスクと特性のばらついた装置でそのまま記録すると、適正な記録が行われず、再生信号にエラーが発生するという課題があった。

【解決手段】書き込み可能な光ディスクから、マーク長とスペース長の可能な複数の組合せに対し、それについて記録パルスの位置を特定した記録パルス標準条件を読み出し、この記録パルス標準条件で試し書きを行い、記録パルス標準条件を一律または個別的に変化させ、最適な記録パルス条件を求め、ジッタの低減を図る。



(2)

特開2000-200418

2

1

## 【特許請求の範囲】

【請求項1】マーク長とスペース長の可能な複数の組合せに対し、それぞれについて記録パルスの位置情報を特定した記録パルス標準条件が予め記録されている書き込み可能な光ディスクから該記録パルス標準条件を読み出し、該記録パルス標準条件を修正し、最適な記録パルス条件を求める方法であって、

該記録パルス標準条件にある全てのマーク長とスペース長の組合せに対する位置情報を用いて、光ディスク上に第1の試し書きを行い、

第1の試し書きを再生し、再生信号から第1ジッタを検出し、

該記録パルス標準条件にある全てのマーク長とスペース長の組合せに対する位置情報を用いて、光ディスク上に第2の試し書きを行い、

第2の試し書きを再生し、再生信号から第2ジッタを検出し、

第1ジッタと第2ジッタを比較し、ジッタが少ない方の試し書きに用いた位置情報を選択する記録パルス条件を求める方法。

【請求項2】さらに、該記録パルス標準条件にある全てのマーク長とスペース長の組合せに対する位置情報を一律に第2所定量の変化を加え、一律変化した位置情報を用いて、光ディスク上に第3の試し書きを行い、

第3の試し書きを再生し、再生信号から第3ジッタを検出し、

第1ジッタと第2ジッタと第3ジッタを比較し、ジッタが少ない方の試し書きに用いた位置情報を選択する請求項1記載の記録パルス条件を求める方法。

【請求項3】マーク長とスペース長の可能な複数の組合せに対し、それぞれについて記録パルスの位置情報を特定した記録パルス標準条件が予め記録されている書き込み可能な光ディスクから該記録パルス標準条件を読み出し、該記録パルス標準条件を修正し、最適な記録パルス条件を求める方法であって、

該記録パルス標準条件にある全てのマーク長とスペース長の組合せの内、いずれか一つの組合せに対する位置情報を用いて、光ディスク上に第1の試し書きを行い、

第1の試し書きを再生し、再生信号から第1ジッタを検出し、

該記録パルス標準条件にある全てのマーク長とスペース長の組合せの内、上記いずれか一つの組合せに対する位置情報に第1所定量の変化を加え、変化した位置情報を用いて、光ディスク上に第2の試し書きを行い、

第2の試し書きを再生し、再生信号から第2ジッタを検出し、

第1ジッタと第2ジッタを比較し、ジッタが少ない方の試し書きに用いた位置情報を選択する記録パルス条件を求める方法。

19

【請求項4】さらに、該記録パルス標準条件にある全てのマーク長とスペース長の組合せの内、上記いずれか一つの組合せに対する位置情報を第2所定量の変化を加え、変化した位置情報を用いて、光ディスク上に第3の試し書きを行い、

第3の試し書きを再生し、再生信号から第3ジッタを検出し、

第1ジッタと第2ジッタと第3ジッタを比較し、ジッタが少ない方の試し書きに用いた位置情報を選択する請求項3記載の記録パルス条件を求める方法。

【請求項5】いずれか一つの組合せに対し選択した第1の位置情報を、別の組合せに対し選択した第2の位置情報がある場合、2つの組合せの中間にある位置情報は、第1の位置情報と、第2の位置情報の補間ににより求める請求項3記載の記録パルス条件を求める方法。

【請求項6】マーク長とスペース長の可能な複数の組合せに対し、それぞれについて記録パルスの位置情報を特定した記録パルス標準条件が予め記録されている書き込み可能な光ディスクから該記録パルス標準条件を読み出し、該記録パルス標準条件を修正し、最適な記録パルス条件を求める装置であって、

該記録パルス標準条件にある全てのマーク長とスペース長の組合せに対する位置情報を用いて、光ディスク上に第1の試し書きを行う試し書き手段と、

第1の試し書きを再生し、再生信号から第1ジッタを検出するジッタ検出手段とを有し、

上記試し書き手段は、該記録パルス標準条件にある全てのマーク長とスペース長の組合せに対する位置情報を一律に第1所定量の変化を加え、一律変化した位置情報を用いて、光ディスク上に第2の試し書きを行い、

上記ジッタ検出手段は、上記第2の試し書きを再生し、再生信号から第2ジッタを検出し、

さらに、第1ジッタと第2ジッタを比較し、ジッタが少ない方の試し書きに用いた位置情報を選択する選択手段を有する記録パルス条件を求める装置。

【請求項7】さらに、上記試し書き手段は、該記録パルス標準条件にある全てのマーク長とスペース長の組合せに対する位置情報を一律に第2所定量の変化を加え、一律変化した位置情報を用いて、光ディスク上に第3の試し書きを行い、

上記ジッタ検出手段は、第3の試し書きを再生し、再生信号から第3ジッタを検出し、

上記選択手段は、第1ジッタと第2ジッタと第3ジッタを比較し、ジッタが少ない方の試し書きに用いた位置情報を選択する請求項6記載の記録パルス条件を求める装置。

【請求項8】マーク長とスペース長の可能な複数の組合せに対し、それぞれについて記録パルスの位置情報を特定した記録パルス標準条件が予め記録されている書き込み可能な光ディスクから該記録パルス標準条件を読み

50

(3)

特開2000-200418

3  
出し、該記録パルス標準条件を修正し、最適な記録パルス条件を求める装置であって、  
該記録パルス標準条件にある全てのマーク長とスペース長の組合せの内、いずれか一つの組合せに対する位置情報を用いて、光ディスク上に第1の試し書きを行う試し書き手段と、  
第1の試し書きを再生し、再生信号から第1ジッタを検出するジッタ検出手段とを有し、  
上記試し書き手段は、該記録パルス標準条件にある全てのマーク長とスペース長の組合せの内、上記いずれか一つの組合せに対する位置情報に第1所定値の変化を加え、変化した位置情報を用いて、光ディスク上に第2の試し書きを行い。  
上記ジッタ検出手段は、上記第2の試し書きを再生し、再生信号から第2ジッタを検出し、  
さらに、第1ジッタと第2ジッタを比較し、ジッタが少ない方の試し書きに用いた位置情報を選択する選択手段を有する記録パルス条件を求める装置。  
【請求項9】さらに、上記試し書き手段は、該記録パルス標準条件にある全てのマーク長とスペース長の組合せの内、上記いずれか一つの組合せに対する位置情報に第2所定値の変化を加え、変化した位置情報を用いて、光ディスク上に第3の試し書きを行い。  
上記ジッタ検出手段は、第3の試し書きを再生し、再生信号から第3ジッタを検出し、  
上記選択手段は、第1ジッタと第2ジッタと第3ジッタを比較し、ジッタが少ない方の試し書きに用いた位置情報を選択する請求項8記載の記録パルス条件を求める装置。  
【請求項10】いずれか一つの組合せに対し選択した第1の位置情報と、別の組合せに対し選択した第2の位置情報がある場合、2つの組合せの中間にある位置情報は、第1の位置情報と、第2の位置情報の補間ににより求める請求項8記載の記録パルス条件を求める装置。

## 【発明の詳細な説明】

## 【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、特定領域に記録パルス標準条件が予め記録されている書き込み可能な光ディスクから、前記記録パルス標準条件を読み出して、記録再生装置の記録パルス条件を設定し、データの記録再生をする光ディスクの記録パルス条件を求める方法および装置に関するものである。

## 【0002】

【従来の技術】大容量のデータが音換え可能な光ディスクの例としてDVD-RAM規格があり、相変化記録膜を用いた直徑12cmの光ディスク片面に、マークエッジ記録方式で2.6GBのデータが記録可能な装置がすでに実用化されている。発明者らは、より高密度な光ディスクを実用化するために、相変化光ディスクの高密度記録で問題となるマーク間の熱干渉によるマークエッジ位

4

置のずれを小さくできるディスク記録方法（参考文献：特許第2679596号）を検討している。  
【0003】前記ディスク記録方法は、ディスク上にデータをアモルファスのマークとしてマークエッジ記録する場合に、レーザ光をマルチパルスと呼ばれる複数のパルス列で構成して記録する。高密度記録では、記録するマークサイズおよびスペース（マーク間）の距離が小さいため、マークを形成するために加えたレーザ光の熱が自己マークのみならずスペースを伝わって前後のマークにまで到達し、自己マークおよび前後のマーク形状にひずみが発生する。これを回避するために、マークを形成するためのマルチパルスの先頭パルス位置を、自己マーク長と前スペース長の関係で、かつ、マークを形成するためのマルチパルスの最終パルス位置を、自己マーク長と後スペース長の関係で変化させることによって、マーク間の熱干渉を予め矯正して記録する。この記録パルス位置の制御は、一般に記録信頼とよばれている。記録パルス条件（記録信頼のパラメータ）にはマークスペースの組み合わせ毎に異なる値があり、例えば、図2に示すような表となる。表内の各値のマークとスペースの位置関係を図3に示す。

【0004】実際の光ディスク記録再生装置を実現するためには、記録補償をおこなうための記録パルス条件を、装置またはディスクに記憶しておく必要がある。特性の異なる、すなわち記録パルス条件が異なる複数のディスクを使用可能とするためには、この値をディスク上に予め記録しておき、使用するときに装置で読み出して設定すればよい。

## 【0005】

【発明が解決しようとする課題】光ディスクの記録再生装置を量産した時、使用部品の特性ばらつきや、環境変化などで、個々の装置が常に同一の特性を有するとは限らない。例えば、記録に関係のあるレーザ駆動手段とレーザを搭載したヘッドは、レーザ特性のばらつきを主要因として、たとえ同一の電流波形をレーザに供給しても、パルス幅が変わる。個々の装置で常に同じ発光波形が得られるとは限らない。同様に光ディスク自体も量産時に、ある程度の特性ばらつきが発生し、同一の発光波形で記録しても個々のディスクで常に同じマーク形状が得られるとは限らない。

【0006】従って、標準的な特性を有する基準ディスクを用いて、標準的な特性を有する基準装置で決定された記録パルス標準条件を、特性のばらついた量産したディスクと装置でそのまま使用すると、組み合わせによっては適正な記録再生が行われず、品質不良が発生するという課題があった。

【0007】更に、十分な品質管理の元で製造された特性ばらつきの小さいディスクであれば問題は少ないが、ディスク上に予め記録してある記録パルス標準条件が、ディスク性能と大きくずれている場合は、装置がディス

50

(4)

特開2000-200418

5

クから読み出した記録パルス標準条件を忠実に再現しても、このディスクでは特性を発揮することができないという課題が発生する。

【0008】本発明は、上述の課題を解決するものであり、特定領域に記録パルス標準条件が予め記録されている書き込み可能な光ディスクから、前記記録パルス標準条件を読み出して、記録再生装置の記録パルス条件を設定し、データの記録再生をする光ディスクの記録条件設定方法において、書き込み可能な光ディスク、および記録再生装置の特性ばらつきの影響を低減することができる光ディスクの記録条件設定方法を提供することを第1の目的とする。また、特定領域に記録パルス標準条件が予め記録されている書き込み可能な光ディスクの、光ディスク特性と記録パルス標準条件に差異がある場合でも良好な記録特性を実現し得る光ディスクの記録条件設定方法を提供することを第2の目的とする。また、前記第2の目的を達成するための光ディスクの記録条件設定方法より記録再生回数を少なくし時間短縮を図ることができる光ディスクの記録条件設定方法を提供することを第3の目的とする。

【0009】

【課題を解決するための手段】上述の第1の目的を達成するために、特定領域に記録パルス標準条件が予め記録されている書き込み可能な光ディスクから、前記記録パルス標準条件を読み出して、記録再生装置の記録パルス条件を設定し、データの記録再生をする光ディスクの記録条件設定方法において、前記記録パルス標準条件のうち、前スペース長と自己マーク長の組み合せによって定められた複数のマーク前端パルス条件すべてと、自己マーク長と後スペース長の組み合せによって定められた複数のマーク後端パルス条件すべてを、それぞれ一律に所定時間シフトして、記録再生信号のジッタが許容値以下となるように標準条件から補正した値を記録再生装置の記録パルス条件として設定し、データの記録再生をする。

【0010】また、上述の第2の目的を達成するためには、前記記録パルス標準条件のうち、前スペース長と自己マーク長の組み合せによって定められた複数のマーク前端パルス条件各々と、自己マーク長と後スペース長の組み合せによって定められた複数のマーク後端パルス条件各々に対応した記録バタンを記録し、その再生信号のジッタが許容値以下となるように各標準条件をそれぞれ別々に補正した値を記録再生装置の記録パルス条件として設定し、データの記録再生をする。

【0011】また、上述の第3の目的を達成するためには、前記記録パルス標準条件のうち、選択された前スペース長と自己マーク長の組み合せによって定められた複数のマーク前端パルス条件各々と、選択された自己マーク長と後スペース長の組み合せによって定められた複数のマーク後端パルス条件各々に対応した記録バタン

を記録し、その再生信号のジッタが許容値以下となるように各標準条件をそれぞれ別々に補正した値を記録再生装置の記録パルス条件として設定し、選択されなかった記録パルス条件は前記選択された記録パルス条件の補正値から補間によって求めた値を記録再生装置の記録パルス条件として設定し、データの記録再生をする。

【0012】第1の観点による本発明は、マーク長とスペース長の可能な複数の組合せに対し、それについて記録パルスの位置情報を特定した記録パルス標準条件が予め記録されている書き込み可能な光ディスクから該記録パルス標準条件を読み出し、該記録パルス標準条件を修正し、最適な記録パルス条件を求める方法であって、該記録パルス標準条件にある全てのマーク長とスペース長の組合せに対する位置情報を用いて、光ディスク上に第1の試し書きを行い、第1の試し書きを再生し、再生信号から第1ジッタを検出し、該記録パルス標準条件にある全てのマーク長とスペース長の組合せに対する位置情報に一律に第1所定値の変化を加え、一律変化した位置情報を用いて、光ディスク上に第2の試し書きを行い、第2の試し書きを再生し、再生信号から第2ジッタを検出し、第1ジッタと第2ジッタを比較し、ジッタが少ない方の試し書きに用いた位置情報を選択する記録パルス条件を求める方法である。

【0013】第2の観点による本発明は、さらに、該記録パルス標準条件にある全てのマーク長とスペース長の組合せに対する位置情報に一律に第2所定値の変化を加え、一律変化した位置情報を用いて、光ディスク上に第3の試し書きを行い、第3の試し書きを再生し、再生信号から第3ジッタを検出し、第1ジッタと第2ジッタと第3ジッタを比較し、ジッタが少ない方の試し書きに用いた位置情報を選択する第1の観点の記録パルス条件を求める方法である。

【0014】第3の観点による本発明は、マーク長とスペース長の可能な複数の組合せに対し、それについて記録パルスの位置情報を特定した記録パルス標準条件が予め記録されている書き込み可能な光ディスクから該記録パルス標準条件を読み出し、該記録パルス標準条件を修正し、最適な記録パルス条件を求める方法であって、該記録パルス標準条件にある全てのマーク長とスペース長の組合せの内、いずれか一つの組合せに対する位置情報を用いて、光ディスク上に第1の試し書きを行い、第1の試し書きを再生し、再生信号から第1ジッタを検出し、該記録パルス標準条件にある全てのマーク長とスペース長の組合せの内、上記いずれか一つの組合せに対する位置情報に第1所定値の変化を加え、変化した位置情報を用いて、光ディスク上に第2の試し書きを行い、第2の試し書きを再生し、再生信号から第2ジッタを検出し、第1ジッタと第2ジッタを比較し、ジッタが少ない方の試し書きに用いた位置情報を選択する記録パルス条件を求める方法である。

【0015】第4の観点による本発明は、さらに、該記録パルス標準条件にある全てのマーク長とスペース長の組合せの内、上記いずれか一つの組合せに対する位置情報に第2所定量の変化を加え、変化した位置情報を用いて、光ディスク上に第3の試し書きを行い、第3の試し書きを再生し、再生信号から第3シャッタを検出し、第1シャッタと第2シャッタと第3シャッタを比較し、シャッタが少ない方の試し書きに用いた位置情報を選択する第3の観点の記録パルス条件を求める方法である。

【0016】第5の観点による本発明は、いずれか一つの組合せに対し選択した第1の位置情報と、別の組合せに対し選択した第2の位置情報がある場合、2つの組合せの中間にある位置情報は、第1の位置情報と、第2の位置情報の補間により求める第3の観点の記録パルス条件を求める方法である。

【0017】第6の観点による本発明は、マーク長とスペース長の可能な複数の組合せに対し、それぞれについて記録パルスの位置情報を特定した記録パルス標準条件が予め記録されている書き込み可能な光ディスクから該記録パルス標準条件を読み出し、該記録パルス標準条件を修正し、最適な記録パルス条件を求める装置であって、該記録パルス標準条件にある全てのマーク長とスペース長の組合せに対する位置情報を用いて、光ディスク上に第1の試し書きを行う試し書き手段と、第1の試し書きを再生し、再生信号から第1シャッタを検出するシャッタ検出手段とを有し、上記試し書き手段は、該記録パルス標準条件にある全てのマーク長とスペース長の組合せに対する位置情報に一律に第1所定量の変化を加え、一律変化した位置情報を用いて、光ディスク上に第2の試し書きを行い、上記シャッタ検出手段は、上記第2の試し書きを再生し、再生信号から第2シャッタを検出し、さらに、第1シャッタと第2シャッタを比較し、シャッタが少ない方の試し書きに用いた位置情報を選択する選択手段を有する記録パルス条件を求める装置である。

【0018】第7の観点による本発明は、さらに、上記試し書き手段は、該記録パルス標準条件にある全てのマーク長とスペース長の組合せに対する位置情報に一律に第2所定量の変化を加え、一律変化した位置情報を用いて、光ディスク上に第3の試し書きを行い、上記シャッタ検出手段は、第3の試し書きを再生し、再生信号から第3シャッタを検出し、上記選択手段は、第1シャッタと第2シャッタと第3シャッタを比較し、シャッタが少ない方の試し書きに用いた位置情報を選択する第6の観点の記録パルス条件を求める装置である。

【0019】第8の観点による本発明は、マーク長とスペース長の可能な複数の組合せに対し、それぞれについて記録パルスの位置情報を特定した記録パルス標準条件が予め記録されている書き込み可能な光ディスクから該記録パルス標準条件を読み出し、該記録パルス標準条件を修正し、最適な記録パルス条件を求める装置であつ

て、該記録パルス標準条件にある全てのマーク長とスペース長の組合せの内、いずれか一つの組合せに対する位置情報を用いて、光ディスク上に第1の試し書きを行う試し書き手段と、第1の試し書きを再生し、再生信号から第1シャッタを検出するシャッタ検出手段とを有し、上記試し書き手段は、該記録パルス標準条件にある全てのマーク長とスペース長の組合せの内、上記いずれか一つの組合せに対する位置情報に第1所定量の変化を加え、変化した位置情報を用いて、光ディスク上に第2の試し書きを行い、上記シャッタ検出手段は、上記第2の試し書きを再生し、再生信号から第2シャッタを検出し、さらに、第1シャッタと第2シャッタを比較し、シャッタが少ない方の試し書きに用いた位置情報を選択する選択手段を有する記録パルス条件を求める装置である。

【0020】第9の観点による本発明は、さらに、上記試し書き手段は、該記録パルス標準条件にある全てのマーク長とスペース長の組合せの内、上記いずれか一つの組合せに対する位置情報に第2所定量の変化を加え、変化した位置情報を用いて、光ディスク上に第3の試し書きを行い、上記シャッタ検出手段は、第3の試し書きを再生し、再生信号から第3シャッタを検出し、上記選択手段は、第1シャッタと第2シャッタと第3シャッタを比較し、シャッタが少ない方の試し書きに用いた位置情報を選択する第8の観点の記録パルス条件を求める装置である。

【0021】第10の観点による本発明は、いずれか一つの組合せに対し選択した第1の位置情報と、別の組合せに対し選択した第2の位置情報がある場合、2つの組合せの中間にある位置情報は、第1の位置情報と、第2の位置情報の補間により求める第8の観点の記録パルス条件を求める装置である。

【0022】

【発明の実施の形態】以下、本発明の好ましい実施の形態として、具体的な光ディスクと記録再生装置を用いて3通りの実施の形態について説明する。

【0023】まず、本実施の形態で用いる記録方式について述べる。光ディスクにデータを書き込む場合にマルチパルスによるマークエッジ記録方式を用い、データをマークとスペースの長さ情報としてディスクに書き込む。また、マークの長さが、3Tから14T (Tはクロック1周期分の時間)、スペースの長さが、3Tから14Tの整数値の組み合わせである変調方式を使うものとする。さらに、本実施の形態では、長さが3Tと4Tと5T以上のマーク (3Tm, 4Tm, 5Tmと略す。) と長さが3Tと4Tと5T以上のスペース (3Ts, 4Ts, 5Tsと略す。) の組合せにおいて、マークとスペースの境界部分で、マーク形状のひずみやマーク間干渉が発生すると仮定する。ひとつのマークについて、スペースと隣接する部分は、マークの前端と後端の2箇所ある。したがって、記録時に用いる記録パルスのエッジ位置を、これらの組み合わせで記録補償することで正

(5)

特開2000-200418

10

しいマーク長の記録状態が達成される。5 Tm以上と5 Ts以上の組み合わせを一つの組合せとすると、マーク前端パルス条件は3×3の9通り、マーク後端パルス条件も3×3の9通りの組み合わせがあり、それぞれ異なる値の条件を設定することが出来、合計18の条件の設定値を持つ。図2は、マーク前端パルス条件とマーク後端パルス条件の値の表である。たとえば、図2の表(A)において、左上の「5 Tm 5 Ts」は、5 T以上 のスペースとそれに続く5 T以上のマークとの境界におけるマーク前端パルスの条件が入っていることを示す。図2の表(B)において、右上の「3 Tm 5 Ts」は、3 Tのマークとそれに続く5 T以上のスペースとの境界におけるマーク後端パルスの条件が入っていることを示す。

【0024】図3に示すように、図2の表の「5 Tm 5 Ts」(Tsが先で、Tmが後)等は、光ディスクに記録したい記録バタンの先端エッジと、実際にレーザを駆動するための連続した記録パルスの先頭パルスとの位置関係を示し、「5 Tm 5 Ts」(Tmが先で、Tsが後)等は、光ディスクに記録したい記録バタンの終端エッジと、実際にレーザを駆動するための連続した記録パルスの末尾パルスとの位置関係を示す。すなわち、図3は、これらの値について、ディスク上のマークスペースと記録パルスとの関係を示している。

【0025】例えば、図2のマーク前端パルス条件が3 Ts 5 Tmであれば、自己マーク長が5 Tm以上であり、その直前のスペース長が3 Tsの時の条件を定めている。このときの条件とは、図3の左下に示すように、3 Tスペースの次に5 T以上のマークを記録するときに、記録パルスの前端位置を記録バタンの先端エッジ(すなわち、スペースとマークの境界)から値3 Ts 5 Tmだけ後に時間をずらしてレーザ記録することである。

【0026】特性の基準となる代表ディスクと、基準となる代表記録再生装置を用いて図2に示す18個の条件を決定する。決定された記録パルス条件を、記録パルス標準条件として、ディスク上の特定領域に予め記録しておくものとする。なお、記録パルス標準条件には他の項目もあり、例えば、記録パルスの先頭パルスの幅、中間パルスの幅、最終パルスの幅、最終パルスの後ろに付ける冷却パルスの幅などがある。本実施の形態では、一例として、記録するマークとスペースの組み合わせバタンによって適応的に値が変わるパルス条件を対象として説明する。

【0027】(実施の形態1)図1は、本発明の光ディスクの記録条件設定方法を実現する光ディスクの記録再生装置のブロック図である。まず、構成要素および信号の説明をする。1はデータを書き込み可能な相変化型の光ディスク、2は光ディスク1を回転させるモータ、3は回転する光ディスク1から記録されているデータを読

10

20

30

40

50

みとり、再生信号4を得るヘッド、5は再生信号4の周波数特性を補正した後、データフィードバックスライス送によりアナログの再生信号からディジタルの2値化信号6を得るイコライザ2値化手段、7は2値化信号6のエッジを検出して、これに同期した再生クロックを生成し2値化信号6を再生クロックに同期化したデータ8に変換するとともに、前記再生クロックのエッジと2値化信号6のエッジの時間ずれ差を位相誤差パルス11として出力するPLL手段、9はデータ8から記録パルス標準条件10を検出する記録パルス標準条件復調手段、12は位相誤差パルス11を2値化信号6のHまたはLによって分別し、それぞれパルス幅の平均値を電圧に変換し、マーク前端シッタ電圧13とマーク後端シッタ電圧14を出力するシッタ判定手段、22はマーク前端シッタ電圧13とマーク後端シッタ電圧14の過去の値を記憶し、所定の許容値との大小関係によって補正値23を出力する記録再生制御手段、25は、記録パルス標準条件10の値に加える変化量を生成し、変化量を補正値23として出力する変化手段、24は記録パルス標準条件10の値に変化量である補正値23を加えた値を記録パルス条件設定値18として出力する記録パルス条件補正手段、15は記録パルス条件を決定するために使用する記録バタン16を発生させるバタン発生手段、17は記録パルス条件設定値18に基づいて記録バタン16をマルチパルスデータ19に変換する記録信号手段、20はマルチパルスデータ19に従って所定の電流でヘッド3に搭載されたレーザを駆動するレーザ駆動手段である。ヘッド3はレーザ駆動手段20から供給される電流21でレーザ光を射出し、光ディスク1に記録を行う。

【0028】シッタ判定手段12は、次のようにして判定する。

【0029】図11において、波形(A)は、バタン発生手段15から発生される記録バタン、波形(B)は、レーザ駆動手段20から発生される記録パルス、波形(C)は、記録マーク、波形(D)は、ヘッド3から得られる再生信号4、波形(E)は、イコライザ2値化手段7から得られる2値化信号、波形(F)は、PLL手段7内で生成される再生クロックを示す。波形(G)、(H)、(I)は、それぞれ異なる場合のシッタの判定値を示す。図11の波形(G)、(H)、(I)のいずれの場合においても、記録バタンが8 Tmパルスの先端エッジに対応する位置では、2値化信号の先端エッジと、再生クロックのエッジが同期しているので、同期している点を中心にシッタ分布がある。図11において記録バタンが4 Tmパルスの先端エッジに対応する位置では、2値化信号の先端エッジが、再生クロックのエッジに対し、進んでいる場合(波形(G))、同期している場合(波形(H))、および遅れている場合(波形(I))が示されている。進んでいる場合は、進んでい

(7)

特開2000-200418

11

る点を中心にジッタ分布がある。同期している場合は、同期している点を中心にジッタ分布があり、遅れている場合は、遅れている点を中心にジッタ分布がある。このようなジッタ分布を時間軸上で集め、重ね合わせたものが波形（G）、（H）、（I）の右端に示されている。同期している場合（波形（H））が多ければ、重ね合わされたジッタ分布の広がり幅は狭い。進んでいる場合（波形（G））や、遅れている場合（波形（I））が含まれると、重ね合わされたジッタ分布の広がり幅は広くなる。このようにして、一定時間毎に、マーク前端ジッタに対するジッタ分布を集め、重ね合わせた結果が信号13として出力される。また、マーク後端ジッタに対するジッタ分布を集め、重ね合わせた結果が信号14として出力される。これら信号13、14がジッタの程度を表し、測定結果として記録再生制御手段22に送られる。

【0030】バタン発生手段15には、ランダムバタンを発生するランダムバタン発生器15aと、予め決められた所定のバタンを発生する所定バタン発生器15bが含まれている。第1の実施の形態においてはランダムバタン発生器15aが用いられ、第2の実施の形態においては所定バタン発生器15bが用いられる。

【0031】変化手段25には、記録パルス標準条件にある9個のデフォルト値全体を一律に変化させる一律変化器25aと、9個のデフォルト値をひとつづつ個別に変化させる個別変化器25bが含まれている。

【0032】次に、本実施の形態の動作ステップについて説明する。まず第1のステップは、光ディスク1にあらかじめ記録されている記録パルス標準条件を読み出す。このために、ヘッド3が回転する光ディスク1の特定領域にスポットを移動させ、予め記録されている記録パルス標準条件のトラックをトレースする。この時の再生信号4をイコライザ2値化手段5で2値化信号6に変換し、PLI手段7で同期化されたデータ8を得る。次に、記録パルス標準条件復調手段9によってデータ8から記録パルス標準条件10を抽出する。記録パルス標準条件10の具体的な一例として、図6の表（B）。

（E）がある。表（B）には、マーク前端パルス条件としてマーク先端における全ての組合せに対するデフォルト値が設定されており、表（E）には、マーク後端パルス条件としてマーク終端における全ての組合せに対するデフォルト値が設定されている。表の中に示されている数値2、4、6等の単位はナノセカンドであり、記録クロック周期Tを17ナノセカンドとする。

【0033】第2のステップは、記録パルス標準条件で光ディスクにデータを試し書きする。このために、まず、ヘッド3のレーザスポットを光ディスク1の書き込み可能なトラックに移動させる。バタン発生手段15において記録バタンとしてランダムバタン発生器15aからランダム信号16を発生する。前述の記録パルス標準

12

条件10を記録パルス条件補正手段24において補正せずにそのまま記録パルス条件設定値18として出力する。記録補償手段17において、ランダム信号16を記録パルス条件設定値に基づいてマルチパルスデータ19に変換する。たとえば、図8に示すように、ランダム信号16に6Ts 4Tm（6Tスペースに続く4Tマーク）の信号が含まれていた場合、4Tマークに対する記録パルスの先頭エッジは、図6の表（B）から+4ナノセカンド時間軸方向にシフトされる。また、図8に示すように、ランダム信号16に4Tm 6Ts（4Tマークに続く6Tマーク）の信号が含まれていた場合、4Tマークに対する記録パルスの末尾パルスのエッジは、図6の表（E）から-25ナノセカンド時間軸方向にシフトされる。先端パルスや末尾パルスのシフトは、パルス全体がシフトされるようにしてもよいし、各パルスの先端エッジがシフトされるようにしてもよい。このように先端パルスと末尾パルスがシフトされたマルチパルスデータ19は、レーザ駆動手段20においてレーザを駆動するための電流21に変換されてヘッド3に供給される。ヘッド3は、前記書き込み可能なトラック上に記録を行う。

【0034】第3のステップは、記録パルス標準条件でパルスがシフトされたマルチパルスデータ19を用いて試し書きしたランダムデータを再生し、再生信号のジッタを測定する。このために、第2のステップで記録したトラックをヘッド3で再生し、イコライザ2値化手段5により2値化信号6を得る。2値化信号6からPLI手段7で再生クロックを生成し、再生クロックと2値化信号の位相誤差パルス11が outputされる。ジッタ測定手段12において、マーク前端ジッタ電圧13とマーク後端ジッタ電圧14を別々に検出する。検出された結果であるマーク前端ジッタ電圧V<sub>f</sub>（0）とマーク後端ジッタ電圧V<sub>r</sub>（0）を記録再生制御手段22に記憶する。ここでカッコ内のは、標準条件であることを示す。ジッタ電圧V<sub>f</sub>（0）、V<sub>r</sub>（0）の記録が行われれば、変化手段25にその旨を伝え、続いて第4のステップが行われる。

【0035】第4のステップは、変化手段25に含まれる一律変化器25aにより、記録パルス標準条件復調手段9から送られてくる記録パルス標準条件10を一律に変化。すなわち時間シフトさせて光ディスクにデータを試し書きする。図5の表（B）、（E）に記録パルス標準条件示されており、これらの表（B）、（E）が一律に変化された一例が表（A）、（D）に示されている。図5において、中央上下2つの表（B）、（E）がディスクから読み出した記録パルス標準条件である。左側の表（A）は、マーク前端パルスの記録パルス標準条件の値に一律に1を加えた補正值を示している。また、左側の表（D）は、マーク後端パルスの記録パルス標準条件の値に一律に-1を加えた補正值を示している。同様

(8)

特開2000-200418

13

に、右側の表（C）は、マーク前端パルスの記録パルス標準条件の値に一律に-1を加えた補正値を示し、右側の表（F）は、マーク後端パルスの記録パルス条件の値に一律に1を加えた補正値を示している。図5の表（A）から（F）の具体的な数値の一例は、図6の表（A）から（F）にそれぞれ示されている。

【0036】第4のステップでは、前端+1である表（A）と、後端-1である表（D）の補正値を用いて試し書きするものとする。一律変化器25aが、補正値23として、マーク前端パルス条件に対して+1を、マーク後端パルス条件に対して-1を出力する。記録パルス条件補正手段24において、記録パルス標準条件10に補正値23を加えて記録パルス条件設定値18を出力する。以下、第2のステップと同様に、ランダム信号を光ディスク1に記録する。

【0037】第5のステップは、第4のステップで記録されたランダムデータを再生し、再生信号のシッタを測定する。第3のステップと同様にして、マーク前端シッタ電圧 $V_f(+1)$ とマーク後端シッタ電圧 $V_r(-1)$ を記録再生制御手段22に記憶する。ここでカッコ内の数値は、標準条件からの変化量を示す。

【0038】さらに、第4と第5のステップを、補正値23を変えながら繰り返し行い、シッタ電圧を収集する。たとえば図4に示すように、マーク前端パルス条件とマーク後端パルス条件の補正値23は、対となって、 $(+1, -1)$ 、 $(+2, -2)$ 、 $(-1, +1)$ 、 $(-2, +2)$ と変化する。 $(+1, -1)$ と変化させた例が図5の表（A）、（D）に示され、さらにその具体的な数値が図6の表（A）、（D）に示されている。この実施の形態においては、変化量+1は、+1ナノセカンドの変化を表している。このように補正値23で記録パルス標準条件を一律変化させ、図4に示すようなプロットされた点が、記録再生制御装置22に記録される。

【0039】図4には、上述のように補正値23を一律変化させて得られたシッタ電圧 $V_f$ 、 $V_r$ の測定結果の例が2つ示されている。シッタ電圧が許容値以下または最も低い場合のマーク前端パルス条件とマーク後端パルス条件の対を採用する。使用している光ディスクの特性と、予め書き込まれている記録パルス標準条件と、記録再生装置の特性が適合していれば、図4（A）のように補正値が0のときに、マーク前端におけるシッタ電圧 $V_f$ とマーク後端におけるシッタ電圧 $V_r$ の両方が最小または許容値より小さくなる。一方、使用している光ディスクの特性と、予め書き込まれている記録パルス標準条件と、記録再生装置の特性が適合していない場合は、図4（B）に示すように、マーク後端のシッタ電圧は、補正値が0の場合は許容値を上回り、補正値が0でないときにシッタが最小または許容値以下となる。

【0040】本発明の実施の形態は、この記録パルス条件の一徴補正と再生シッタの変化に着目した記録条件設

14

定方法であり、各条件で試し書きして得られたマーク前端シッタとマーク後端シッタの組み合わせうち、前端と後端シッタの大きい方が最小値または許容値以下となる組み合わせを装置の最適記録条件として用いることを特徴とする。

【0041】第6のステップは、第4第5のステップで収集されたシッタ電圧により、以後記録再生装置で使用する記録パルス条件設定値を決定する。図1の記録再生制御手段24において、各補正値に対するマーク前端シッタ電圧とマーク後端シッタ電圧のセットの中から、前端と後端シッタ電圧の大きい方が許容値以下となる補正値を選択し、以後の記録再生装置の記録条件として用いる。

【0042】許容値以下を採用条件とすれば、図4（B）の場合は、マーク前端パルス条件とマーク後端パルス条件の補正値が $(-1, +1)$ である対を採用してもよいし、マーク前端パルス条件とマーク後端パルス条件の補正値が $(0, +1)$ である対を採用してもよい。

【0043】採用された補正値は、現在、記録再生装置にローディングされている光ディスクを記録する際に利用する。

【0044】以上のステップによって、本発明の実施の形態は、光ディスクに予め記録されている記録パルス標準条件を読み出して、この記録パルス標準条件のうち、前スペース長と自己マーク長の組み合わせによって定められた複数のマーク前端パルス条件すべてと、自己マーク長と後スペース長の組み合わせによって定められた複数のマーク後端パルス条件すべてを、それぞれ一律に一定量時間シフトして、記録再生信号のシッタが許容値以下となるように標準条件から補正した値を記録再生装置の記録パルス条件として設定し、データの記録再生をする。本方法によって、書き込み可能な光ディスク、および記録再生装置の特性ばらつきの影響を低減し、常に最適な光ディスクの記録再生状態を実現することができる。

【0045】なお、本実施の形態では、補正値23として、マーク前端パルス条件をプラス1したときにマーク後端パルス条件をマイナス1する方法で説明したが、この数値に限るものではなく、前端と後端の各条件を一律に補正する範囲において、様々な組み合わせが存在し、他の補正数値であってもシッタを最小化する本発明の効果を発揮できる。

【0046】（実施の形態2）次に、実施の形態2では、特定領域に記録パルス標準条件が予め記録されている書き込み可能な光ディスクの、光ディスク特性と記録パルス標準条件に差異がある場合でも良好な記録特性を実現しうる光ディスクの記録条件設定方法を具体的に述べる。実施の形態2においても図1を用いて説明する。実施の形態1と異なる部分について説明し、同じ部分は省略する。本実施の形態では、18個の記録パルス条件

(9)

特開2000-200418

15

のうち、 $5\text{Ts}$   $5\text{Tm}$  と  $5\text{Tm}$   $5\text{Ts}$  の 2 つの値は記録パルス標準条件をそのまま使うものとする。さらに、残り 16 個の記録パルス条件を決定するために、それぞれに対応した 12 種類の記録パタンを用いる。このような 12 種類の記録パタンは、パタン発生手段 15 の所定パタン発生器 15b により生成される。

【0047】各記録パルス条件と使用する記録パタンの関係を図 7 に示す。

【0048】例えば、自己マーク長 4 Tm で前マーク長 5 Ts 以上のマーク前端パルス条件  $5\text{Ts}$   $4\text{Tm}$  を決定するため、図 7 (A) に示す記録パタン (1) を使用する。記録パタン (1) は 8 Tm, 6 Ts, 4 Tm, 6 Ts の繰り返し信号である。すべての記録パタンは、マーク長の合計とスペース長の合計が同じで、かつ、マークとスペースを 2 個ずつ含み、決定すべきエッジを変化させ、他の 3 つのエッジは固定して使用することを特徴とする。図 7においては、変化させるマーク前端エッジを○、変化させるマーク後端エッジを☆で表現している。残りは全て固定エッジである。

【0049】本実施の形態の動作ステップについて説明する。以下、自己マーク長 4 Tm で前マーク長 5 Ts 以上のマーク前端パルス条件  $5\text{Ts}$   $4\text{Tm}$  を決定するため記録パタン (1) を使用する例を詳しく説明するが、他の記録パルス条件を決定するステップは、記録パタンが異なる点をのぞけば同様である。

【0050】まず、第 1 のステップは、光ディスク 1 にあらかじめ記録されている記録パルス標準条件を読み出す。このステップは実施の形態 1 と同じである。

【0051】第 2 のステップは、記録パルス条件  $5\text{Ts}$   $4\text{Tm}$  を決定するために所定記録パタン (1) を光ディスクに試し書きする。 $5\text{Ts}$   $4\text{Tm}$  の記録パルス標準条件をそのまま記録パルス条件設定値 18 として出力し、記録補償手段 18において、記録パタン (1) を記録パルス条件設定値に基づいてマルチパルスデータ 19 に変換する。マルチパルスデータ 19 は、レーザ駆動手段 20においてレーザを駆動するための電流 21 に変換されてヘッド 3 に供給される。ヘッド 3 は、前記書き込み可能なトラック上に記録を行う。

【0052】第 3 ステップは、試し書きした記録パタン (1) を再生し、再生信号のジッタを測定する。このために、第 2 のステップで記録したトラックをヘッド 3 で再生し、イコライザ 2 値化手段 5 により 2 値化信号 6 を得る。2 値化信号 6 から PLSI 手段 7 で再生クロックを生成し、再生クロックと 2 値化信号の位相誤差パルス 11 が outputされる。ジッタ測定手段 12 において、位相誤差パルス 11 の幅の平均値をジッタ電圧としてマーク前端ジッタ電圧  $V_f(0)$  を表す信号 13 を出力する。ここで、カッコ内の 0 は、記録パタン (1) の変化させるエッジに対する記録パルスの変化置がりであること、すなわち記録パルス標準条件 10 からのデフォルト値 4

16

(図 6 の表 (B) 内の  $5\text{Ts}$   $4\text{Tm}$  に対応する個所の値) がそのまま用いられた結果得られたジッタ電圧であることを示す。なお、本ステップはマーク前端パルス条件をもとめる場合であるので、マーク前端ジッタ電圧  $V_f$  のみを検出する。反対に、マーク後端パルス条件を求める場合には、マーク後端ジッタ電圧  $V_f$  のみを検出する。検出したマーク前端ジッタ電圧  $V_f(0)$  を記録再生制御手段 22 に記憶する。ジッタ電圧  $V_f(0)$  の記録が行われれば、変化手段 25 にその旨を伝え、続いて第 4 のステップが行われる。

【0053】第 4 のステップでは、まず変化手段 25 にある個別変化器 25 から、マーク前端パルス条件  $5\text{Ts}$   $4\text{Tm}$  のデフォルト値 4 に対する補正值 23 として、例えば +1 を出力する。記録パルス条件補正手段 24 は、記録パルス標準条件 10 に含まれる  $5\text{Ts}$   $4\text{Tm}$  のデフォルト値 4 に補正值 23 である +1 を加えた値 5 を、記録パルス条件設定値 18 として出力する。以下、第 2 のステップと同様に、記録パタン (1) を光ディスク 1 に記録する。

【0054】第 5 のステップは、第 4 のステップで記録された記録パタン (1) を再生し、再生信号のジッタを測定する。第 3 のステップと同様にして、マーク前端ジッタ電圧  $V_f(1)$  を記録再生制御手段 22 に記憶する。さらに、第 4 と第 5 のステップを補正值 23 を変えながら繰り返し行い、ジッタ電圧を収集する。

【0055】ここで、記録パタン (1) を用いて記録パルス条件  $5\text{Ts}$   $4\text{Tm}$  の補正值 23 を +1, +2, +3 と変化させたときの記録再生波形をそれぞれ図 8, 図 9, 図 10 に示す。

【0056】図 8 (B) の  $5\text{Ts}$   $4\text{Tm}$  は、+1 で補正されており、この条件で記録した場合、図 8 (C) に示すように、記録された 4 T マークの前端エッジ位置が、理想的な位置に比べて左方向にずれている。従って、再生信号 (図 8 (D)) を 2 値化した 2 値化信号 (図 8 (E)) と、再生クロック (図 8 (F)) の位相ずれを表す位相誤差パルス (図 8 (G)) は、4 T マーク前端エッジ部分で幅が太くなっている。従って、位相誤差パルスの幅の平均値を示すジッタ電圧  $V_f(+1)$  は大きい。

【0057】また、図 9 (B) の  $5\text{Ts}$   $4\text{Tm}$  は、+2 で補正されており、この条件で記録した場合、図 9 (C) に示すように、記録された 4 T マークの前端エッジは理想的な位置である。従って、再生信号 (図 9 (D)) を 2 値化した 2 値化信号 (図 9 (E)) と、再生クロック (図 9 (F)) の位相ずれを表す位相誤差パルス (図 9 (G)) はすべて幅が細い。従って、位相誤差パルスの幅の平均値を示すジッタ電圧  $V_f(+2)$  は小さい。

【0058】さらに、図 10 (B) の  $5\text{Ts}$   $4\text{Tm}$  は、+3 で補正されており、この条件で記録した場合、図 10 (C) に示すように、記録された 4 T マークの前端エッジは理想的な位置である。従って、再生信号 (図 10 (D)) を 2 値化した 2 値化信号 (図 10 (E)) と、再生クロック (図 10 (F)) の位相ずれを表す位相誤差パルス (図 10 (G)) はすべて幅が細い。従って、位相誤差パルスの幅の平均値を示すジッタ電圧  $V_f(+3)$  は小さい。

(10)

特關2000-200418

17

① (C) に示すように、記録された 4 T マークの前端エッジ位置が、理想的な位置に比べて右方向にずれている。従って、再生信号 (図 10 (D)) を 2 錯化した 2 錯化信号 (図 10 (E)) と、再生クロック (図 10 (F)) の位相ずれを表す位相誤差パルス (図 10 (G)) は、4 T マーク前端エッジ部分で幅が太くなる。従って、位相誤差パルスの幅の平均値を示すジャッタ修正 VF (+3) は大きい。

【0059】本発明の実施の形態は、この記録バルス条件の補正条件と再生シッタ電圧の変化に着目した記録条件設定方法であり、各条件で試し書きして得られたマーク前端シッタが許容値以下または最小となる補正值を装置の最適記録条件として用いることを特徴とする。

〔0060〕第6のステップは、第4、第5のステップで収集されたジッタ電圧 $V_f$ により、以後、記録再生装置で使用する記録パルス条件 $5\text{ T s }4\text{ T m}$ の設定値を決定する。すなわち、複数回の試し書きおよびその読み取りの結果から、ジッタ電圧 $V_f$ が最低値または許容値以下の場合を求める。その場合の補正値を採用する。図8、図9、図10で示した例の場合であれば、マーク前端パルス条件 $5\text{ T s }4\text{ T m}$ の補正値は+2が採用されることになる。このようにして、図1の記録再生制御手段24において、各補正値に対するマーク前端ジッタ電圧が許容値以下または最小となる補正値を選択し、以後の記録再生装置のマーク前端パルス条件 $5\text{ T s }4\text{ T m}$ の値として用いる。

【006】以降同様に、マーク後端パルス条件4 Tm 5 Tsを決定するために記録バタン(1)を使用して試し書きを行い、マーク後端ジッタ電圧V<sub>0</sub>が許容値以下または最小となる補正値を選択し、以後の記録再生装置のマーク後端パルス条件4 Tm 5 Tsの値として用いる。次は、マーク前端パルス条件4 Ts 5 Tmを決定するために記録バタン(2)を使用して試し書きを行い、マーク前端ジッタ電圧V<sub>1</sub>が許容値以下または最小となる補正値を選択し、以後の記録再生装置のマーク前端パルス条件4 Ts 5 Tmの値として用いる。このようにして、記録バタンを変えながら第2のステップから第6のステップを繰り返す。

【0062】以上のステップによって、本発明の実施の形態は、光ディスクに予め記録されている記録パルス標準条件を読み出して、この記録パルス標準条件のうち、前スペース長と自己マーク長の組み合わせによって定められた複数のマーク前端パルス条件々々と、自己マーク長と後スペース長の組み合わせによって定められた複数のマーク後端パルス条件々々とに対応した記録バタン(図7(A)から(P))を記録し、その再生信号のシッタが許容値以下または最小となるように各標準条件をそれそれ別々に補正した値を記録再生装置の記録パルス条件として設定しデータの記録再生をする。本方法によって、書き込み可能な光ディスクの特性と記録パルス標準

18

進条件に差異がある場合でも、記録パルス条件の各値を、使用する光ディスクと記録再生装置の組み合わせで最適な値に補正することができるので、常に良好な光ディスクの記録再生状態を実現することができる。

〔0063〕（実施の形態3）次に、実施の形態2の入  
テップより記録再生回数を少なくし時間短縮を図る方法  
について具体例を説明する。図2において、マーク前端  
パルス条件が5T<sub>s</sub>3T<sub>u</sub>である場合、図7の記録パタ  
ン（3）を用いて上述の実施の形態2に従い決定する。

19 圖2において、マーク前端パルス条件が3 Ts 3 Tmである場合、図7の記録バタン(11)を用いて決定する。ここで、マーク前端パルス条件が4 Ts 3 Tmである場合を決定するためには、記録バタン(7)を用いて決定するのではなく、求めた5 Ts 3 Tmの補正值と、標準条件の5 Ts 3 Tmの値と、求めた3 Ts 3 Tmの補正值と、標準条件の3 Ts 3 Tmの値と、標準条件の4 Ts 3 Tmの値の関係から、4 Ts 3 Tmの補正值を補間などの計算で求める。この4 Ts 3 Tmの補正值を決定する動作は電気的な計算演算であるので、記録バタン(7)を実際に記録再生する場合に比較して、所要時間がはるかに小さい。

〔0064〕 すなわち、本発明の実施形態は、全記録パルス条件を、対応した各記録パタンの記録再生によって決定するのではなく、一部の条件は、他の条件から演算によって導き出す事とする。

[0065]このために、図1の光ディスクの記録再生装置において、記録パルス標準条件のうち、選択された前スペース長と自己マーク長の組み合わせによって定められた複数のマーク前縫パルス条件々々と、選択された自己マーク長と後スペース長の組み合わせによって定められた複数のマーク後縫パルス条件々々に対応した記録パターンを記録し、その再生信号のシッタが許容値以下となるように各標準条件をそれぞれ別々に補正した値を記録再生装置の記録パルス条件として設定する（以上、一部、実施の形態2のステップと同様）。記録再生制御手段24において、選択されなかった記録パルス条件は、前記選択された記録パルス条件の補正值から補間にによって求めた値を記録再生装置の記録パルス条件として設定し、データの記録再生をする。これによって、すべての記録パルス条件を設定し終わるまでの時間が大幅に短縮できる。

〔0066〕なお、本実施の形態では、記録パルス条件のうち  $T_s$   $\sim$   $5T_m$  と  $5T_m$   $\sim$   $T_s$  は、光ディスクから読み出した記録パルス標準条件をそのまま使用した例を示したが、これに限るものではなく、例えば、 $6T_m$   $\sim$   $6T_s$  の繰り返し信号を記録してアシンメトリまたはデューティーを検出する方法等で補正を行ってから本発明の記録条件設定方法を適用してもよい。さらに、記録パターンとして、図7に示すパターンを用いたが、マーク長の合計とスペース長の合計が同じで、かつ、マークとスペー

(11)

特開2000-200418

19

スを2個ずつ含み、少なくとも1つの決定すべき属性のエッジを含むバタンであれば、ジッタ検出が可能である。

【0067】また、実施の形態1と実施の形態2で、記録波形を2値パワーの例で説明したが、パワーが多値の場合であっても同様の効果が得られる。さらに、記録パルス条件が $3 \times 3 \times 2$ の18個の場合で説明したが、 $4 \times 4 \times 2$ などパラメータ数が増えても同様に実施することができる。ただし、実施の形態2において使用する記録バタンはパラメータ数に応じて増やす必要がある。

【0068】

【発明の効果】以上のように、本発明の光ディスクの記録条件設定方法によれば、特定領域に記録パルス標準条件が予め記録されている書き込み可能な光ディスクから、前記記録パルス標準条件を読み出して、記録再生装置の記録パルス条件を設定し、データの記録再生をする光ディスクの記録条件設定方法において、書き込み可能な光ディスク、および記録再生装置の特性ばらつきの影響を低減することができる。また、特定領域に記録パルス標準条件が予め記録されている書き込み可能な光ディスクの、光ディスク特性と記録パルス標準条件に差異ある場合でも良好な記録特性を実現することができる。したがって、光ディスクおよび記録再生装置の大量生産時の歩留まりが向上し、製品の品質向上とコスト削減に効果がある。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施の形態における光ディスクの記録再生装置のブロック図

【図2】記録パルス条件を示す表

【図3】記録パルス条件の説明図

【図4】実施の形態1におけるジッタ測定結果を示す特性グラフ

【図5】実施の形態1における一律時間シフトの表

【図6】一律時間シフトについて具体的な数値を示した表\*

\*【図7】実施の形態2における記録バタン波形図

【図8】実施の形態2における記録再生動作を示す波形図

【図9】実施の形態2における記録再生動作を示す波形図

【図10】実施の形態2における記録再生動作を示す波形図

【図11】ジッタ測定の方法を示す波形図

【符号の説明】

10 1 光ディスク

2 モータ

3 ヘッド

4 再生信号

5 イコライザ2値化手段

6 2値化信号

7 PLI手段

8 データ

9 記録パルス標準条件復調手段

10 記録パルス標準条件

11 位相誤差パルス

12 ジッタ測定手段

13 マーク前端ジッタ電圧

14 マーク後端ジッタ電圧

15 バタン発生手段

16 記録バタン

17 記録偏倚手段

18 記録パルス条件設定値

19 マルチパルスデータ

20 レーザ駆動手段

30 21 記録電流

22 記録再生制御手段

23 税正値

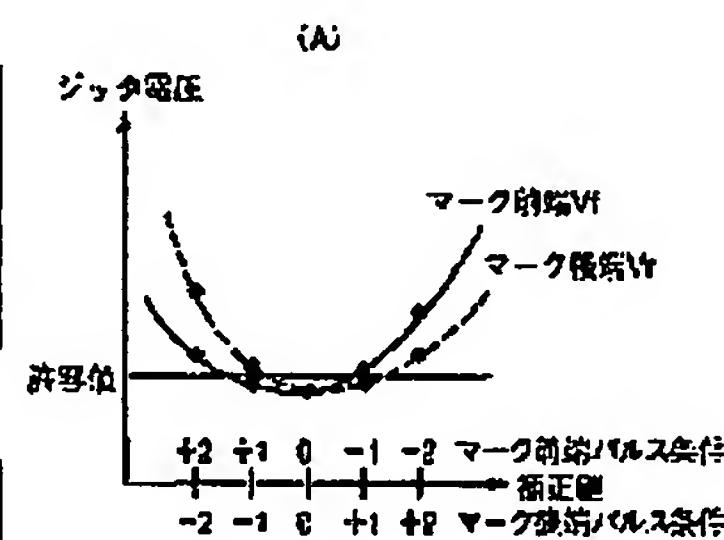
24 記録パルス条件税正手段

25 変化手段

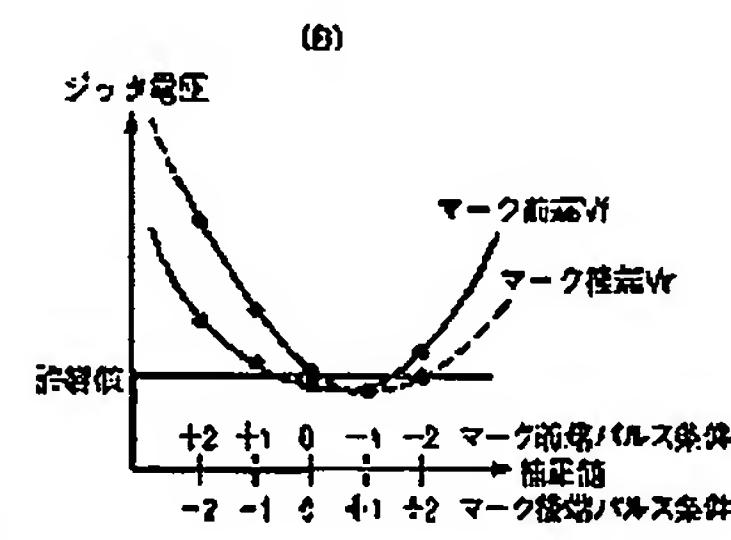
【図2】

マーク前端パルス条件		自己マーク長	
前スベース長	5Tm以上	4Tm	3Tm
5Tm以上	5TmT9	5TmT8	5TmT7
4Tm	4TmT9	4TmT8	4TmT7
3Tm	3TmT9	3TmT8	3TmT7

マーク後端パルス条件		自己マーク長	
後スベース長	5Tm以上	4Tm	3Tm
5Tm以上	5TmT9	5TmT8	5TmT7
4Tm	4TmT9	4TmT8	4TmT7
3Tm	3TmT9	3TmT8	3TmT7



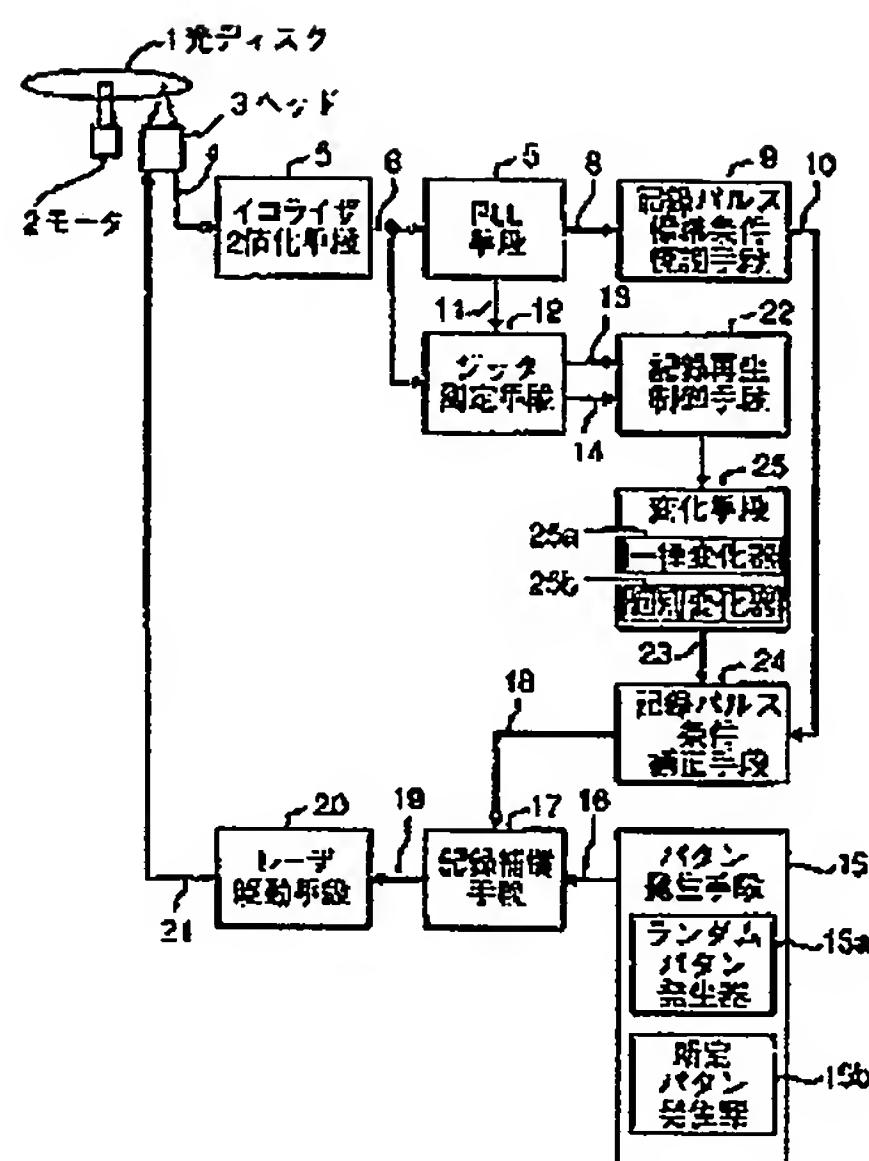
【図4】



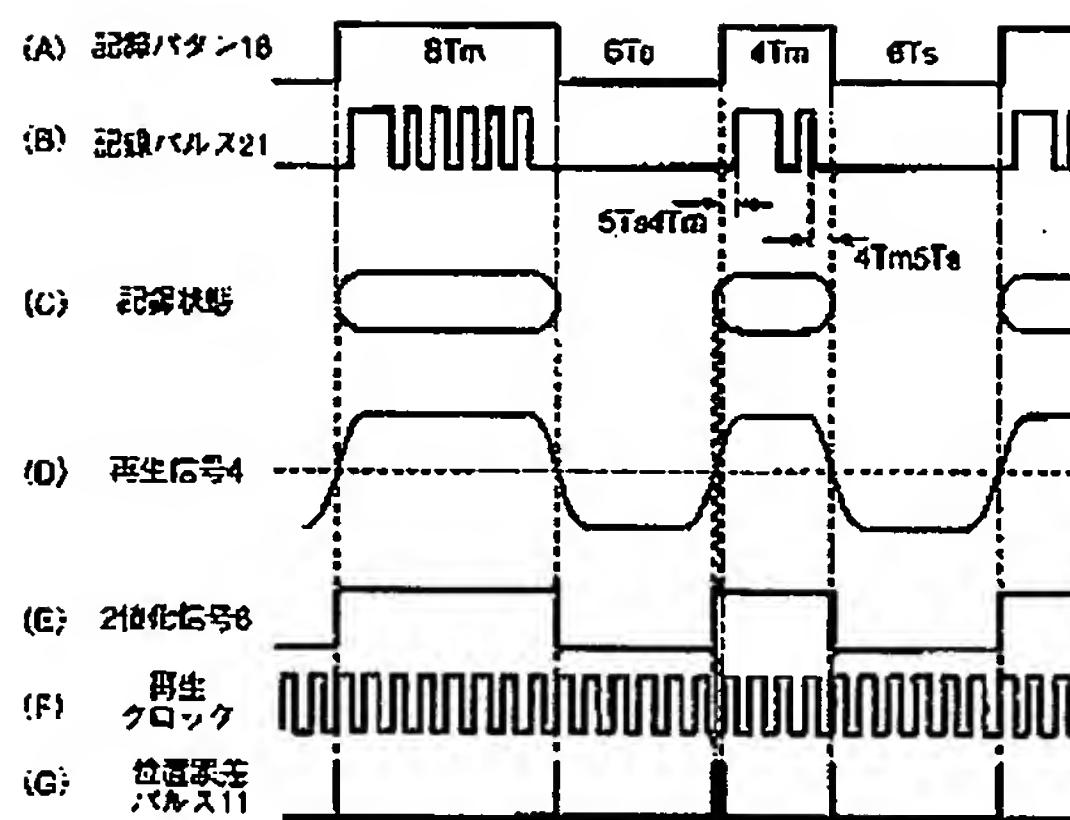
(12)

特開2000-200418

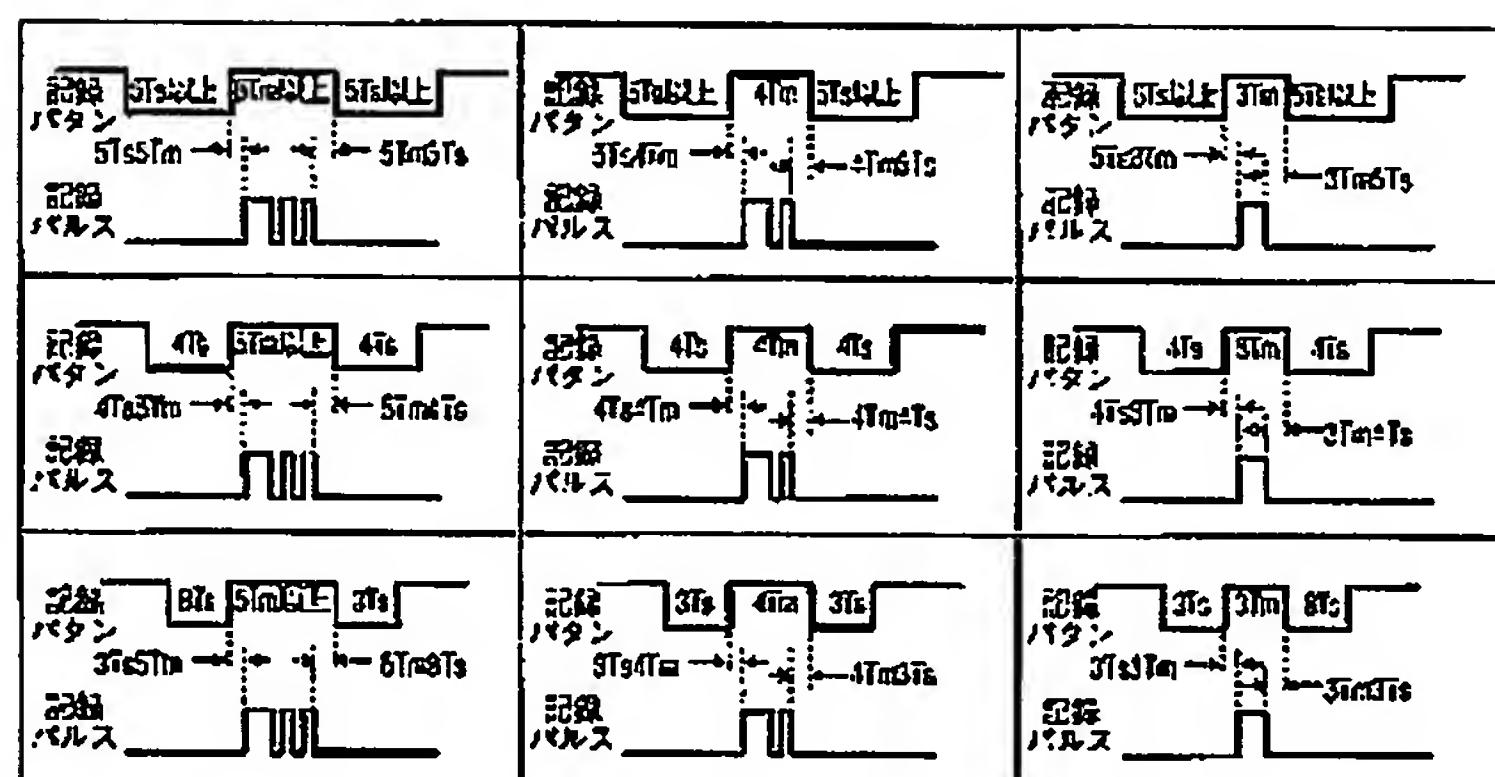
【図1】



【図8】



【図3】



(13)

特開2000-200418

【図5】

(A) マーク前端パルス条件 自己マーク反			
自己マーク長			
5Tm 以上 4Tm 3Tm			
前 ス ペ ー ス 長	5Ts 以上	5Ts5Tm 5Ts4Tm 5Ts3Tm	11 +1 +1
	4Ts	4Ts5Tm 4Ts4Tm 4Ts3Tm	-1 -1 -1
	3Ts	3Ts5Tm 3Ts4Tm 3Ts3Tm	+1 +1 +1
(B) マーク前端パルス条件 自己マーク反			
自己マーク長			
5Tm 以上 4Tm 3Tm			
前 ス ペ ー ス 長	5Ts 以上	5Ts5Tm 5Ts4Tm 5Ts3Tm	-1 -1 -1
	4Ts	4Ts5Tm 4Ts4Tm 4Ts3Tm	-1 -1 -1
	3Ts	3Ts5Tm 3Ts4Tm 3Ts3Tm	-1 -1 -1
(C) マーク前端パルス条件 自己マーク長			
自己マーク長			
5Tm 以上 4Tm 3Tm			
前 ス ペ ー ス 長	5Ts 以上	5Ts5Tm 5Ts4Tm 5Ts3Tm	-1 -1 -1
	4Ts	4Ts5Tm 4Ts4Tm 4Ts3Tm	-1 -1 -1
	3Ts	3Ts5Tm 3Ts4Tm 3Ts3Tm	-1 -1 -1
(D) マーク後端パルス条件 自己マーク反			
自己マーク長			
5Tm 以上 4Tm 3Tm			
後 ス ペ ー ス 長	5Ts 以上	5Ts5Ts 4Ts3Ts 3Ts5Ts	-1 -1 -1
	4Ts	5Ts4Ts 4Ts3Ts 3Ts4Ts	-1 -1 -1
	3Ts	5Ts3Ts 4Ts3Ts 3Ts3Ts	-1 -1 -1
(E) マーク後端パルス条件 自己マーク長			
自己マーク長			
5Tm 以上 4Tm 3Tm			
後 ス ペ ー ス 長	5Ts 以上	5Ts5Ts 4Ts5Ts 3Ts5Ts	-1 -1 -1
	4Ts	5Ts4Ts 4Ts4Ts 3Ts4Ts	-1 -1 -1
	3Ts	5Ts3Ts 4Ts3Ts 3Ts3Ts	-1 -1 -1
(F) マーク後端パルス条件 自己マーク長			
自己マーク長			
5Tm 以上 4Tm 3Tm			
後 ス ペ ー ス 長	5Ts 以上	5Ts5Ts 4Ts5Ts 3Ts5Ts	-1 -1 -1
	4Ts	5Ts4Ts 4Ts4Ts 3Ts4Ts	-1 -1 -1
	3Ts	5Ts3Ts 4Ts3Ts 3Ts3Ts	-1 -1 -1

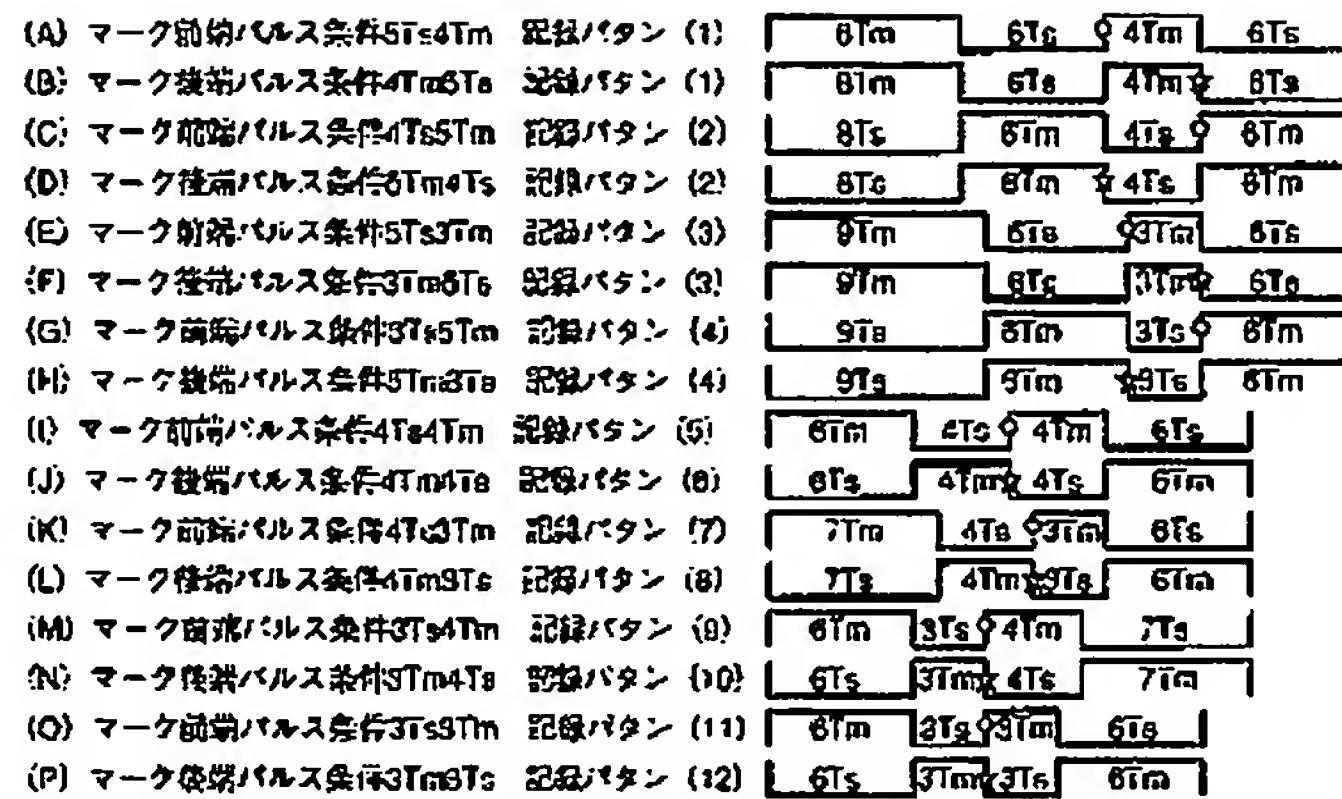
【図6】

一律シフト条件1(前端+1、後端-1)			
(A) マーク前端パルス条件 自己マーク反			
自己マーク長			
5Tm 以上 4Tm 3Tm			
前 ス ペ ー ス 長	5Ts 以上	3 5 7	
	4Ts	2 4 6	
	3Ts	1 3 5	
(B) 能翻パルス復原条件 自己マーク反			
自己マーク長			
5Tm 以上 4Tm 3Tm			
前 ス ペ ー ス 長	5Ts 以上	2 4 6	
	4Ts	1 3 5	
	3Ts	0 2 4	
(C) 一律シフト条件2(前端-1、後端+1)			
(D) マーク後端パルス条件 自己マーク反			
自己マーク長			
5Tm 以上 4Tm 3Tm			
後 ス ペ ー ス 長	5Ts 以上	-25 -26 -28	
	4Ts	-24 -25 -27	
	3Ts	-23 -24 -26	
(E) マーク後端パルス条件 自己マーク反			
自己マーク長			
5Tm 以上 4Tm 3Tm			
後 ス ペ ー ス 長	5Ts 以上	-24 -25 -27	
	4Ts	-23 -24 -26	
	3Ts	-22 -23 -25	
(F) マーク後端パルス条件 自己マーク反			
自己マーク反			
5Tm 以上 4Tm 3Tm			
後 ス ペ ー ス 長	5Ts 以上	-23 -24 -26	
	4Ts	-22 -23 -25	
	3Ts	-21 -22 -24	

(14)

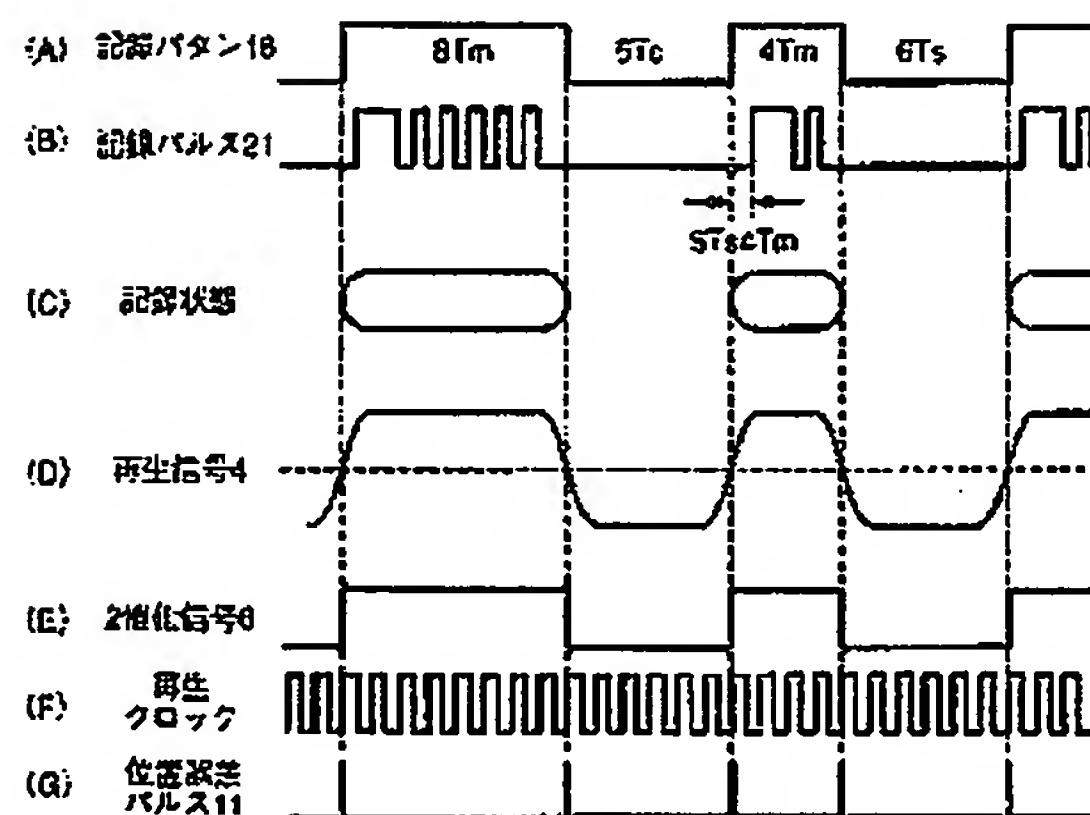
特開2000-200418

[図7]



◎変化させるマーク前端エッジ  
☆変化させるマーク後端エッジ

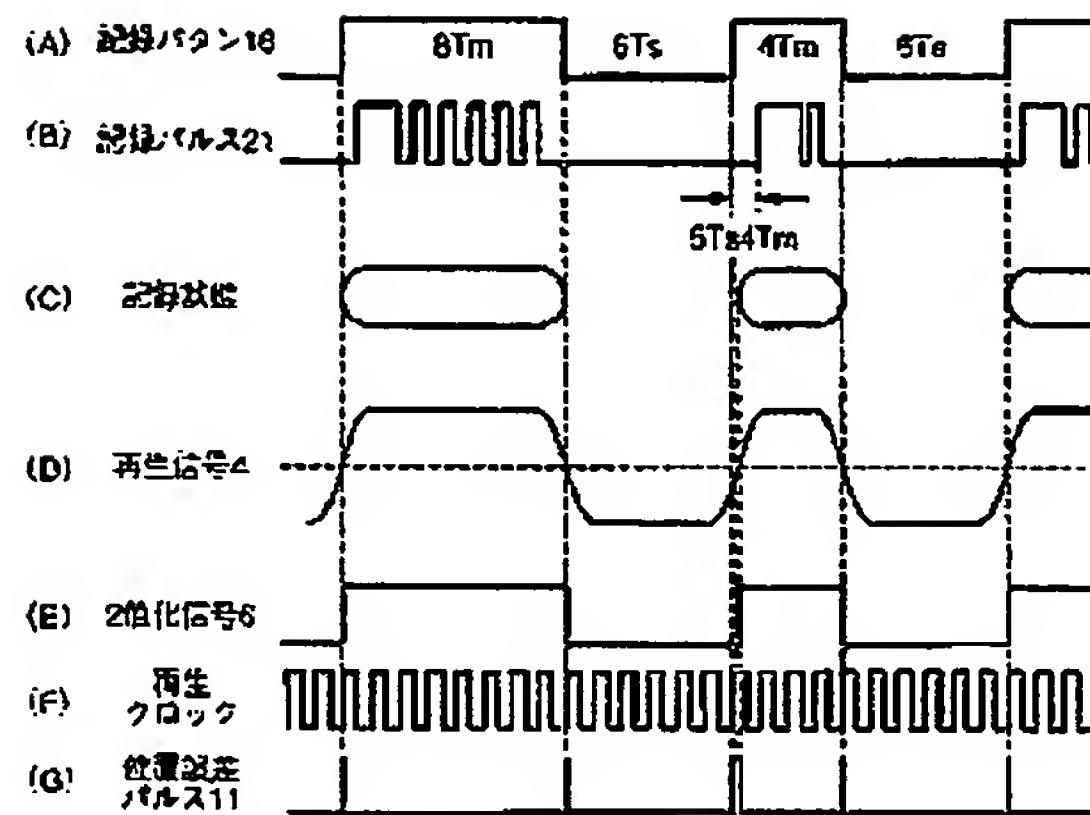
[図9]



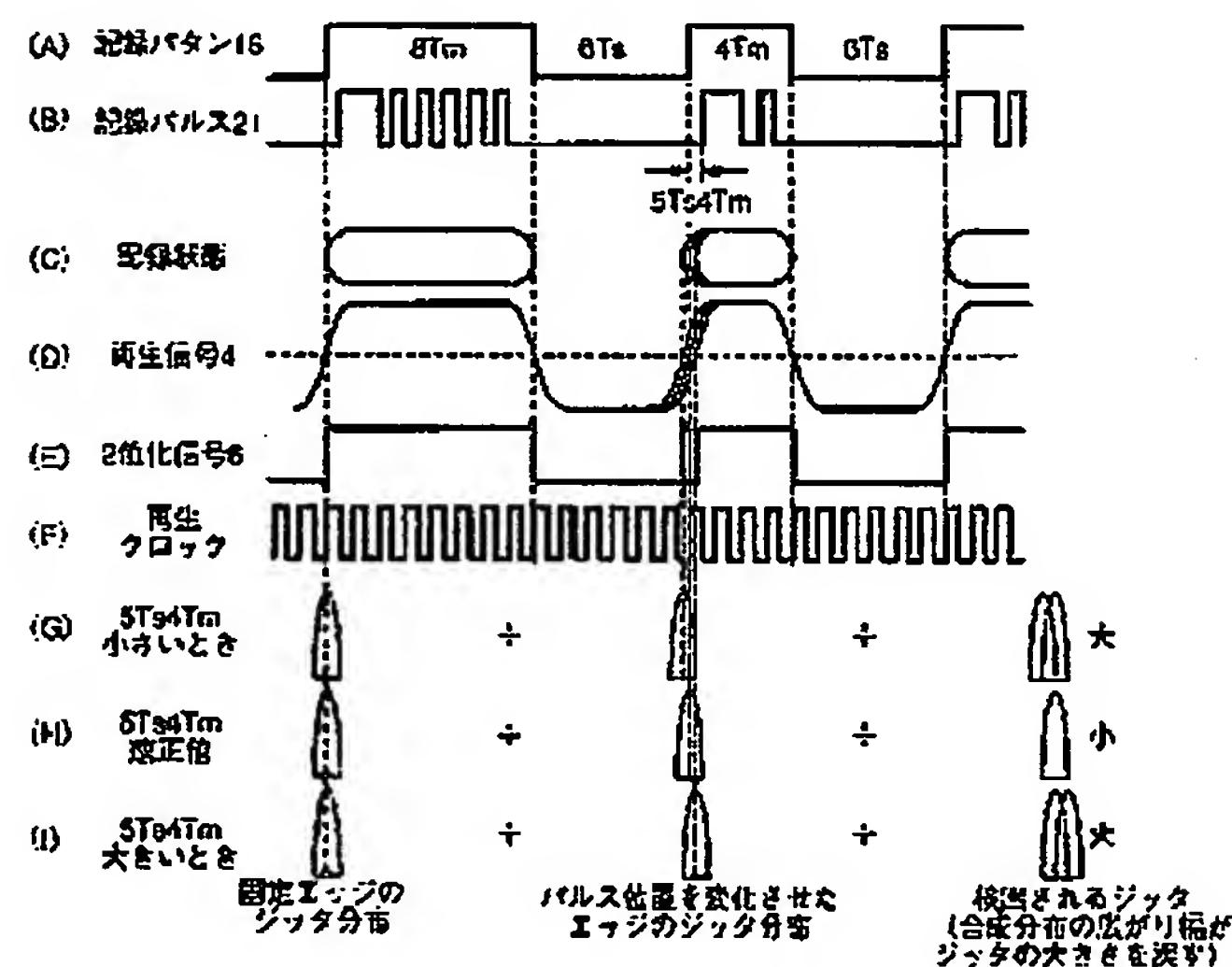
(15)

特開2000-200418

【図10】



【図11】



**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning  
Operations and is not part of the Official Record**

**BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- BLACK BORDERS**
- IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- FADED TEXT OR DRAWING**
- BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- SKEWED/SLANTED IMAGES**
- COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- GRAY SCALE DOCUMENTS**
- LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- OTHER:** \_\_\_\_\_

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.**